

テスターバーンイン用  
LSI及び低価格装置  
を開発

# エスティケイ テクノロジー 株式会社



代表取締役社長  
宮川 未晴

大分県  
大分市大字三佐2468-10

1975年(昭和50年)設立  
TEL 097-527-2161

<http://www.stk-net.co.jp/>

ソフトウェアからハードウェアにわたる幅広い技術力を武器に、半導体デバイス試験システムのバーンイン装置で国内約30%のシェアを誇るトップメーカー。

## バーンイン装置のトップメーカー

バーンイン装置とは、半導体デバイス等に一定の負荷をかけてテストする装置。つまり、熱をかけた状態で半導体製品を動作させることによって良品・不良品のボーダーライン付近にある製品を強制的に不良品とし、完全な良品のみを短時間で得ようとするものである。同社は昭和50年に設立。幾多の変遷を経て昭和58年にバーンイン装置の第1号機を納入。以降バーンイン装置の国内トップメーカーとなっている。

## 半導体メモリー試験の問題を削減

従来、半導体メモリーの試験は、高速なメモリーテストと低速なバーンイン装置で分担していた。この場合、既存バーンイン装置は低速テストしか出来ないという問題点、メモリーテストは同時測定数が少ない(～64個)という問題点及び高価なメモリーテストによるテストコストの増大化という問題点があった。

そこで、従来のバーンイン装置では不可能であったメモリーテスト機能をLSI化し、バーンインボードに実装することにより特定のメモリーテストを高速に行い、バーンインボードのソケット実装数を活かし、同時測定数を増加させた。

### 従来

#### メモリーテスト



#### バーンイン装置



### 新技術

#### 次世代TBT装置



◎テスターバーンイン装置の高速化  
⇒ **Test Rate 約20~40倍**

◎同時測定数の拡大  
⇒ **約20倍**

◎トータルテストコストの削減